

# 光学干渉式リアルタイム膜厚モニター

## 膜厚測定

本膜厚モニターを用いることにより、様々な薄膜の厚みを非接触でしかもリアルタイムに測定を行うことが可能です。1nmの分解能で10nm～50μmまでの膜厚を測定できます。

測定サンプルより反射される白色光の干渉パターンを観測し、薄膜材料の物性値を用いることにより光学膜厚へと変換されます。単相膜の場合、材料のn値及びk値が予め分かっているならば、膜厚を算出することが可能です。

専用ソフトウェア：AvaSoft-ThinFilmは、一般的によく使用されるマテリアルやコーティング材料（レジスト、酸化物、窒化物、ポリイミド、セルギャップなど）のn値とk値がデータベース化されており、測定対象物に応じて選択することが可能です。



分光器	AvaSpec-Uls2048CL-EVO 又は AvaSpec-Uls2048
	Grating UA(200～1100nm), DCL-UV/VIS, 100 μm slit, DUV coating, OSC-UA
膜厚/分解能	10nm～50 μm, 分解能 : 1 nm
ソフトウェア	AvaSoft-ThinFilm (TFProbe (Multi-layerの場合))
光源	AvaLight-DHc (重水素-ハロゲン ライト)
ファイバー	反射プローブ: FCR-7UV200-2-ME, UV/VIS, 2m, SMA